

19 czerwca 2013



O miarach i mierzeniu na kongresie w Kielcach

Naukowcy – specjaliści z dziedziny metrologii dyskutują w Kielcach o współczesnych problemach metrologii i nowych metodach i narzędziach pomiarowych. Spotkanie odbywa się pod honorowym patronatem rektora Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Stanisława Adamczaka. Gościem Kongresu był wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Kongres Metrologii organizowany jest co trzy lata i jest jedną z najważniejszych konferencji metrologicznych w kraju. Jego ideą jest omówienie współczesnych problemów dotyczących szeroko rozumianej metrologii, czyli nauki o miarach i mierzeniu.